



# 光学顕微鏡の自在ズーム用画像データ

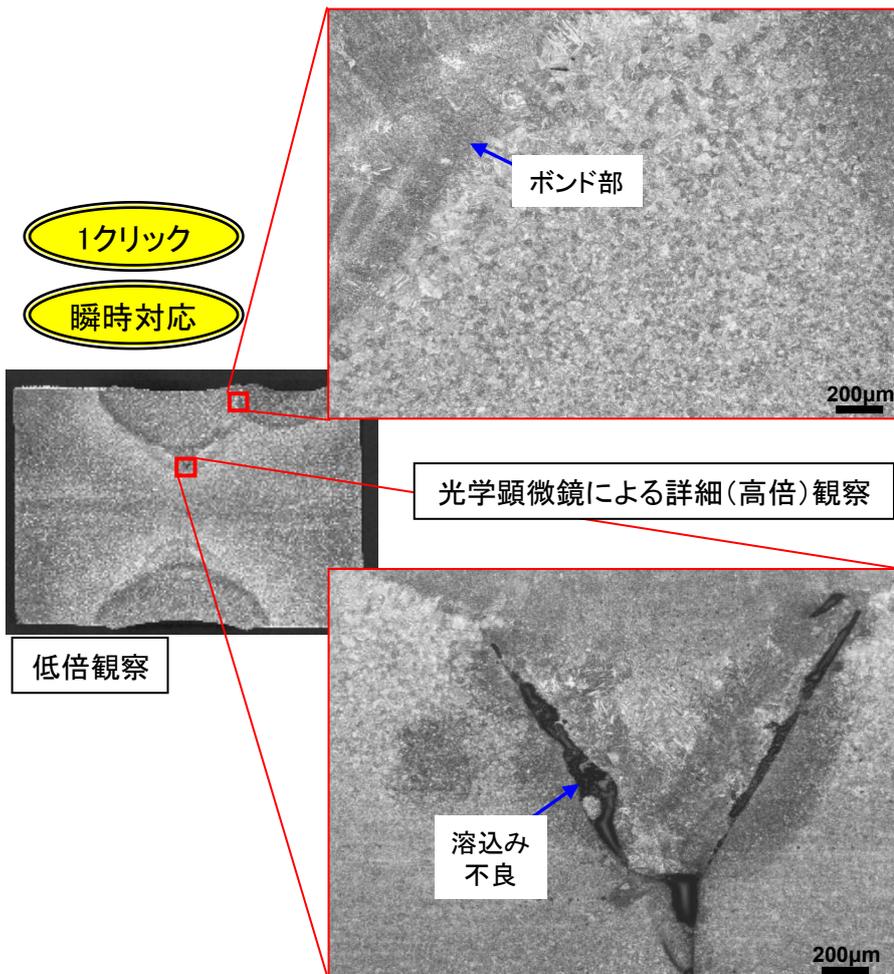
立会観察の時間が取れないお客様のお役に立ちます。

## 試験の概要

- 低倍観察での気になる部分を、1クリックで詳細観察できます。
  - ① 金属最終凝固部の中央偏析周辺、溶接継手・ビード部の断面状態などの大視野と詳細観察の双方の対比が必要なサンプルの際に大いに力を発揮します。
  - ② 従来、低倍観察と高倍の組織観察はそれぞれ専用の顕微鏡で実施していましたが、1台の顕微鏡で観察が可能です。
- 広領域を高倍で連続撮影し、位置情報を基に自動で繋ぎ合えます。
- 長さ50mm×幅50mm程度までの大型サンプルについても対応可能です。
- 撮影した画像データをお客様にご提供し、お客様のパソコンで任意の場所を拡大して観察することができます。

## 試験事例

- 溶接ボンド部および溶込み不良の観察例



## 装置外観



ライカ マイクロシステムズ株式会社製  
インテリジェント顕微鏡(DM6000 M)

## その他に対応可能な試験

- 組織観察  
低倍～1000倍までの光学顕微鏡観察を行います。
- 非金属介在物測定  
ASTM E45、JIS G 0555に準拠して鋼中介在物の解析を行います。
- 結晶粒度測定  
結晶粒界のエッチング技術を用いて、ASTM E112、JIS G 0551に準拠した結晶粒の粒界比率や個数を測定、粒度番号を計算いたします。



JFE テクノリサーチ 株式会社

<https://www.jfe-tec.co.jp>

☎ 0120-643-777

Copyright ©2016 - 2024 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.  
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。